Issue Classification

App	licat	ion/	/Cor	ntrol	No
-----	-------	------	------	-------	----

10764200

Examiner

Wiehe, Nathan

Applicant(s)/Patent	Under	Reexamination	r
---------------------	-------	---------------	---

LEE ET AL.

Art Unit

3745

ORIGINAL				INTERNATIONAL CLASSIFICATION												
CLASS S			UBCLASS	BCLASS CLAIMED				LAIMED	NON-CLAIMED							
415 189				F	0	4	D	29 / 64 (200	6.0)							
CROSS REFERENCE(S		S)		F	0	4	٥	29 / 54 (2006.01	.01)							
										4	·					
CLASS		CLASS (ON	(ONE SUBCLASS PER BLOCK)			ļ					_	_				
415	214.1					ļ										
						 -										
						 						-				·
	1										·					
						· · · · ·										
						<u> </u>										
				<u></u>		_					_	_				
						<u> </u>	_									
	<u> </u>					 -										
						\vdash										
						├						-				
	<u> </u>					 										
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				\vdash										
	·	<u> </u>												<u></u>		
-																
		·										\neg				
											_					,,
						ļ					_	_				
												\dashv				
						<u> </u>						-				
	ļ					-	_				-					
			-					-			_	\dashv				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	·			·	<u> </u>	<u> </u>					\dashv	\dashv				
		<u></u>							-		\dashv	1				
Wiehe, Nathan (1/8/08 (Assistant Examiner) (Date)		Eli	Elwel Khoh						Total Claims Allowed:							
(Legal Instruments (Date) Examiner)			SUPERVISORY PATENT EXAMINER TECHNOLOGY CENTER 3700 (Primary Examiner) (Date) 1/18/08						O.G. Print Claim(s) O.G. Print Figure					O.G. Print Figure		